

Bundesamt für Strahlenschutz
Bekanntmachung gemäß § 11 Röntgenverordnung (RöV)

2. Nachtrag zur Bauartzulassung He/Rö/V3 30/97

vom 21. November 2003

Gemäß §§ 8 ff. der RöV in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGB. I S. 604) wird die Bauartzulassung He/Rö/V3 30/97, erteilt am 19. August 1997 durch das Regierungspräsidium Kassel, einschließlich des 1. Nachtrages vom 29. Mai 2000 geändert.

Bauartzeichen: **He/Rö/V/3 30/97**

Bezeichnung der Vorrichtung: Röntgenspektrometer PW 2800 XRF-Wafer-Analyzer

Bisheriger Inhaber der Zulassung: Philips Industrial Electronics Deutschland GmbH
Miramstraße 87
34123 Kassel

Hersteller der Vorrichtung: Philips Analytical X-Ray B.V., Niederlande

Röntgenstrahler: Philips PW 2592/45 (Rh-Anode)

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

1. Röntgenstrahler

Alternativ zum bisher zugelassenen Röntgenstrahler kann der baugleiche Strahler
PW 2592/35
(XRF Super Sharp Tube Rh 60 kV;
mit einer Leistungsbegrenzung auf 3 kW)

in die Vorrichtung eingesetzt werden

2. Umfirmierung

Zulassungsinhaber PANalytical GmbH
Miramstr. 87, 34123 Kassel

Hersteller der Vorrichtung PANalytical B.V., Lelyweg 1
NL 7602 EA Almelo, Niederlande

Dieser Nachtrag gilt nur im Zusammenhang mit der o.g. Bauartzulassung und dem hierzu ergangenen Nachtrag.

Salzgitter, den 21. November 2003
57502/2-046

Bundesamt für Strahlenschutz
Im Auftrag

Czarwinski